

**M2FL20U****200V 1.5A****特長**

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr=35ns
- 低V<sub>F</sub>=0.92V

**Feature**

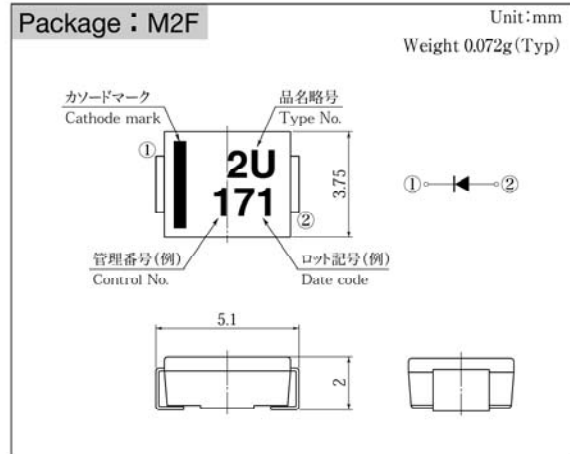
- Small SMD
- Low Noise
- trr=35ns
- Low V<sub>F</sub>=0.92V

**用途**

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、OA
- 通信

**Main Use**

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Office Automation
- Communication

**■外観図 OUTLINE**

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

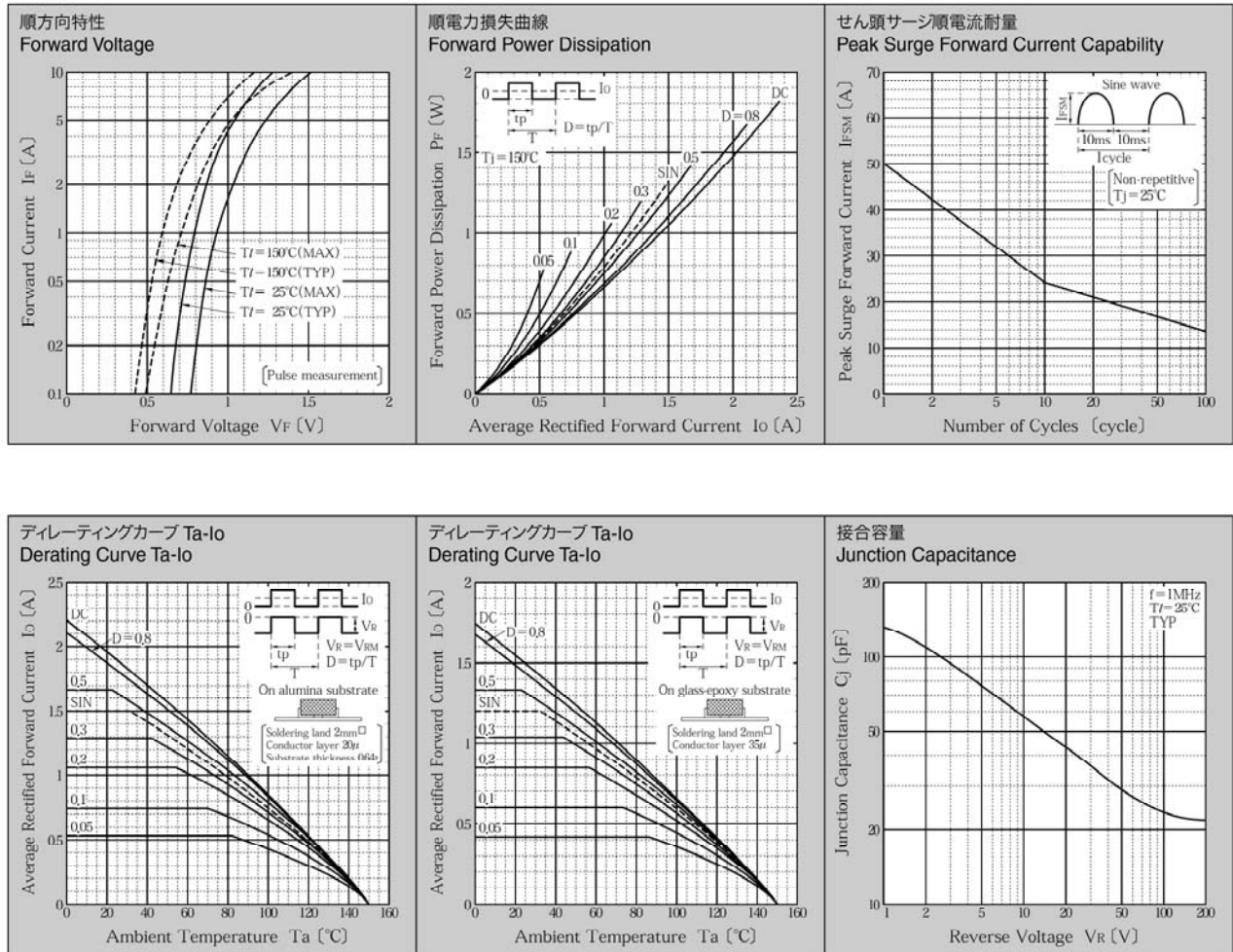
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T<sub>I</sub> = 25℃)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M2FL20U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>			-55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T <sub>j</sub>			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波、抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T <sub>a</sub> = 32℃ プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.2	A
			T <sub>a</sub> = 31℃ アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値、T <sub>j</sub> = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25℃		50	A

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T<sub>I</sub> = 25℃)**

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 1.5A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.92	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = V <sub>RM</sub> , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> = 0.5A, I <sub>R</sub> = 1A	MAX 35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>j-l</sub>	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 33	℃/W
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	
プリント基板実装 On glass-epoxy substrate			MAX 120	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
 Typical is a statistical average of the device's ability.  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.